

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC
925**

1989

**AMENDEMENT 1
AMENDMENT 1**

1996-04

Amendement 1

**Ballasts électroniques alimentés en courant
continu pour lampes tubulaires à fluorescence –
Prescriptions de performances**

Amendment 1

**DC supplied electronic ballasts for tubular
fluorescent lamps –
Performance requirements**

© CEI 1996 Droits de reproduction réservés — Copyright — all rights reserved

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale 3, rue de Varembe Genève, Suisse



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

**CODE PRIX
PRICE CODE**

C

*Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue*

AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le sous-comité 34C: Appareils auxiliaires pour lampes, du comité d'études 34 de la CEI: Lampes et équipements associés.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
34C/329/FDIS	34C/376/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cet amendement.

Page 2

SOMMAIRE

Ajouter le titre de la nouvelle annexe D suivante:

Annexe D – Guide pour coter la durée de vie et le taux de défaillance

Page 36

Ajouter, après l'annexe C, la nouvelle annexe D suivante:

FOREWORD

This amendment has been prepared by sub-committee 34C: Auxiliaries for lamps, of IEC technical committee 34: Lamps and related equipment.

The text of this amendment is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
34C/329/FDIS	34C/376/RVD

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report on voting indicated in the above table.

Page 3

CONTENTS

Add the title of the new annex D as follows:

Annex D – A guide to quoting product life and failure rate

Page 36

Add, after annex C, the following new annex D:

Annexe D (informative)

Guide pour coter la durée de vie et le taux de défaillance

D.1 Pour permettre à l'utilisateur de comparer d'une manière significative la durée de vie et le taux de défaillance de différents produits électroniques, il est recommandé que les données définies aux articles D.2 et D.3 soient fournies par le fabricant.

D.2 La température maximale de surface, symbole t_j (t-lifetime) du produit électronique ou la température maximale de la pièce qui affecte la durée de vie du produit, mesurée dans les conditions normales de fonctionnement, à la tension nominale ou à la valeur maximale de la gamme de tension de fonctionnement, qui permet l'obtention d'une durée de vie de 50 000 h.

NOTE – Dans quelques pays comme le Japon, il convient de prendre en considération une durée de vie de 40 000 h.

D.3 Le taux de défaillance, si le produit électronique est mis en fonctionnement continu à la température maximale t_j (définie à l'article D.2). Il convient que le taux de défaillance soit exprimé en unités en défaut par unité de temps (fit).

D.4 La méthode utilisée pour obtenir les informations données aux articles D.2 et D.3 (analyse mathématique, essais de fiabilité etc.). Il convient que le fabricant fournisse, sur demande, un dossier de données complet contenant les détails de la méthode.